IEEE MILESTONE (36) IEEE 東京支部

First Operational Large-Scale Latent Fingerprint Identification System, 1982

NEC, formerly known as Nippon Electric Company, introduced the world's first large-scale automated fingerprint identification system (NEC AFIS) equipped with a latent fingerprint matching function in 1982. This was a powerful crime-solving tool capable of matching even fragmented latent fingerprints against a large database, a task that previously had been impossible. It enabled the world's police agencies expedite searches for suspects, an efficiency that many public-safety experts valued. Dec 2020

大規模遺留指紋照合システム、1982年

NEC(日本電気(株))は、1982 年に世界で初めて、遺留指紋照合機能を搭載した大規模自動指紋照合システム (NEC AFIS)を発表しました。これは、これまで不可能だった片鱗の遺留指紋でさえも大規模なデータベースと照合できる、強力な犯罪解決ツールでした。これにより、世界中の警察機関が容疑者の捜索を迅速化できるようになり、多くの公安専門家が高く評価する効率性を実現しました。 2020 年 12 月

2020 年 12 月 15 日、「大規模遺留指紋照合システム」の IEEE マイルストーン記念式典が、NEC 本社ビルにて開催され、福田 敏男 IEEE 会長より、NEC 遠藤 信博 取締役会長に、業績を記した銘板が贈呈されました。 銘板は、NEC 本社ビル(東京都港区)に展示されています。



IEEE Milestone 銘板



銘板と記念撮影

(左から) 徳田 英幸 IEEE 東京支部 Chair、白川 功IEEE JCHC Chair、福田 敏男 IEEE 会長、NEC 遠藤信博 会長、NEC 西原 基夫 取締役、NEC 新野 隆社長

IEEE Milestone 認定の経過:

2017年12月28日 Proposal Form 提出

2019年11月25日 Board of Directors 承認

2020 年 12 月 15 日 記念式典開催 (場所) NEC 本社ビル

銘板設置場所: NEC 本社ビル(東京都港区)